آشنایی با کاربردها و روش های تست و آزمون لایه های نازک (X ray Reflectiviti (XRR), Grazing Incident XRD (GIXRD))	
تاریخ برگزاری	۲۰ بهمن ماه ۹٤
ساعت برگزاری	۱۳:۰۰ الی ۱٦:۰۰
مکان برگزاری	خیابان ولیعصر- بالاتر از چهار راه ولیعصر- بعد از خیابان بالاور- ساختمان پژوهشی دانشگاه امیر کبیر- طبقه هشتم- دفتر شوراهای دانشکده
برگزار کننده	شرکت آزما فناور پژوهان وندا
مدرس	خانم مهندس فعال نظری

سرفصل آموزشی

- معرفی، اصول و مبانی روش؛ - کاربردهای GIXRD در مطالعه انواع پوضص ها ولایه های نازک؛ - معرفی انواع نمونه ها و مثال های کاربردی در GIXRD؛ - XRR (X-Rey Reflectivity)؛	- تحلیل مقدماتی نتایج؛ - معرفی انواع نمونه ها و مثال های کاربردی در XRR . - قابلیت ها و محدودیت های ای تکنیک در مقایسه با سایر روش های مطالعه لایه های نازک ؛

هزینه های ثبت نام (ریال)

ثبت نام آزاد	۱۵۰۰۰۰۰
ثبت نام دانشجویی	۱۲۰۰۰۰۰
ثبت نام محقق نانو	٦۰۰۰۰۰
ثبت نام عضو شبکه	۲۵۰۰۰۰
باشگاه مشتریان	۷۵۰۰۰۰

شماره تماس

۰۲۱٦٦۰٦۹۹۱۵ – ۰۲٦۳۳۳۲٤۰۷۸ - ۰۹۱۰٦۹۸۳۸۳۱

ثبت نام در:

www.nanolab.ir

www.vandazma.com